


AK Plasma – Fachausschuss Normung

Bericht Herbstsitzung 2005 Stuttgart

- VDI
- DIN
- ISO
- VAMAS
- **ISO/TC 229 Nanotechnology**



[myBeuth](#) [FAQ](#) [E-Mail](#) [Hilfe](#) [DIN](#)

Recherchieren und Bestellen beim Beuth Verlag von "DIN 50993-1"

Recherchieren nach Normen und Publikationen: Normen als PDF im Download: [myBeuth](#)

Dokumentennr.:	DIN 50993-1
Ausgabe:	2005-05
Sprachen:	Deutsch
Titel (de):	Bestimmung von sechswertigem Chrom in Korrosionsschutzschichten - Teil 1: Qualitative Bestimmung
Titel (en):	Determination of hexavalent chromium in corrosion protection coatings - Part 1: Qualitative analysis
Preis:	Euro 24,70

[Impressum](#) | © 2005 Beuth Verlag GmbH

Die deutsche Norm DIN 50993-1 mit gleichem Titel „Bestimmung von sechswertigem Chrom in Korrosionsschutzschichten - Teil 1: Qualitative Bestimmung“ ist im Mai 2005 erschienen.

[myBeuth](#) [FAQ](#) [E-Mail](#) [Hilfe](#) [DIN](#)

**E DIN EN 15205
Einspruchszeit bereits
abgelaufen,
Verabschiedung
Januar (?) 2006.**

Recherchieren nach Normen und Publikationen: Normen als PDF im Download: [myBeuth](#)

Dokumentennr.:	DIN EN 15205
Ausgabe:	2005-05
Sprachen:	Deutsch
Titel (de):	Bestimmung von sechswertigem Chrom in Korrosionsschutzschichten - Qualitative Bestimmung; Deutsche Fassung prEN 15205:2005
Titel (en):	Determination of hexavalent chromium in corrosion protection layers - Qualitative analysis; German version prEN 15205:2005

"DIN EN 15205"

DIN NMP 161:

DIN 50977 Ausgabedatum Dezember 2005

„Messung von Schichtdicken –

Berührungslose Messung der Dicke von Schichten am kontinuierlich bewegten Messgut“

DIN NMP 141, ISO TC 161/SC 3:

Norm-Entwurf ISO/DIS 14577-4, Ausgabe:2005-08 (In Deutsch und Englisch)

*Metallische Werkstoffe - Instrumentierte Eindringprüfung zur Bestimmung der Härte und anderer
Werkstoffparameter - Teil 4: Prüfung für metallische und nichtmetallische Überzüge*

VDI FA Diamantwerkzeuge:

VDI 2840 Ausgabe:2005-11 (In Englisch und Deutsch)

Kohlenstoffschichten - Grundlagen, Schichttypen und Eigenschaften

VDI 2841

Diamantwerkzeuge

Bearbeitung wird fortgeführt

ISO/TC 201 "Chemische Oberflächenanalyse"

Deutschland beteiligt sich über die Liaison mit VAMAS an der Normenentwicklung:

- Convenor der Arbeitsgruppe Referenzmaterialien des TC201/WG2 : Dr. Unger (BAM) .
- neuer ISO/TR zu ionenimplantierten Referenzmaterialien für die Chemische Analytik an Oberflächen (Federführung BAM)
- Erstellung eines "Survey of Priority and Needs" für die Methoden XPS/ESCA und AES für die nächsten 5-10 Jahre.
(Federführung BAM; Industriebeteiligung: u.a. Schott)
- bis heute wurden bereits 23 Normen erarbeitet.
- SC8 Current projects zur Methode Glow Discharge Mass Spectrometry (GD-MS):
„ISO/CD 15338 - GD-MS Intro to use“ ; (eigentlich zuerst mal als Australischer Standard).

ISO/TC 202 "Elektronenstrahl-Mikroanalyse"

- keine wesentlichen Neuigkeiten, insgesamt wurden 6 Normen erarbeitet.



**MODIFICATION OF THE SCOPE
OF AN ISO TECHNICAL COMMITTEE**
**MODIFICATION DES DOMAINE
DES TRAVAUX D'UN COMITE TECHNIQUE**

ISO/TC 201

N 259

Please complete and return this form to the ISO Central Secretariat
Veuillez compléter et renvoyer ce formulaire au Secrétariat central

Title of the TC
Titre TC

ISO/TC 201: Surface chemical analysis

Current scope of the TC
Domaine des travaux actuel du TC

Standardization in the field of surface chemical analysis in which beams of electrons, ions, neutral atoms or molecules, or photons are incident on the specimen material and scattered or emitted electrons, ions, neutral atoms or molecules, or photons are detected.

Note:

With current techniques of surface chemical analysis, compositional information is obtained for regions close to a surface (generally within 20 nm) and composition-versus-depth information is obtained with surface analytical techniques as surface layers are removed.

Proposed scope of the TC
Domaine des travaux proposé du TC

Standardization in the field of surface chemical analysis. Surface chemical analysis includes analytical techniques in which beams of electrons, ions, neutral atoms or molecules, or photons are incident on the specimen material and scattered or emitted electrons, ions, neutral atoms or molecules, or photons are detected. It also includes techniques in which probes are scanned over the surface and surface-related signals are detected.

Excluded:

Scanning electron microscopy which is within the scope of TC 202.

Note:

With current techniques of surface chemical analysis, analytical information is obtained for regions close to a surface (generally within 20 nm) and analytical information-versus-depth data are obtained with surface analytical techniques over greater depths.

VAMAS TWA2

- **Ringversuch zur Bestimmung der Unsicherheit von XPS Signalintensitäten, die durch Peakfitanalyse gewonnen wurden (Federführung: Cedric Powell, NIST, USA)**

Bei Interesse melden Sie sich bitte persönlich bei Cedric Powell (cedric.powell@nist.gov).

**Insbesondere für akkreditierte Labore
oder für Labore, die eine Akkreditierung vorbereiten,
ist dies eine gute Gelegenheit,
an einem hochwertigen Ringversuch teilzunehmen !**



TMB Secretariat
Vote/Information-Form
Number: **12/2005**
Date: 2005-04-28

ISO TECHNICAL MANAGEMENT BOARD

SUBJECT

Establishment of a new field of technical activity on *Nanotechnologies*

BACKGROUND

Establishment of ISO/TC 229

Voting on TS/P 199 *Nanotechnologies* closed on 20 April 2005. The table of replies and comments received are attached at annex. Of the 29 replies, 25 member bodies voted in favour of the proposal. 21 member bodies wished to participate actively in the work as P-members and 7 as O-members. There was one offer to undertake the secretariat. According to the ISO/IEC Directives, acceptance of such a proposal requires approval by two-thirds of the member bodies voting. The proposal has therefore been accepted.

BSI (United Kingdom), proposer of this TS/P, is the only member body that has offered to assume the secretariat of the new technical committee which, if approved by the TMB, will be designated ISO/TC 229.

ACTION

The members of the Technical Management Board are invited to

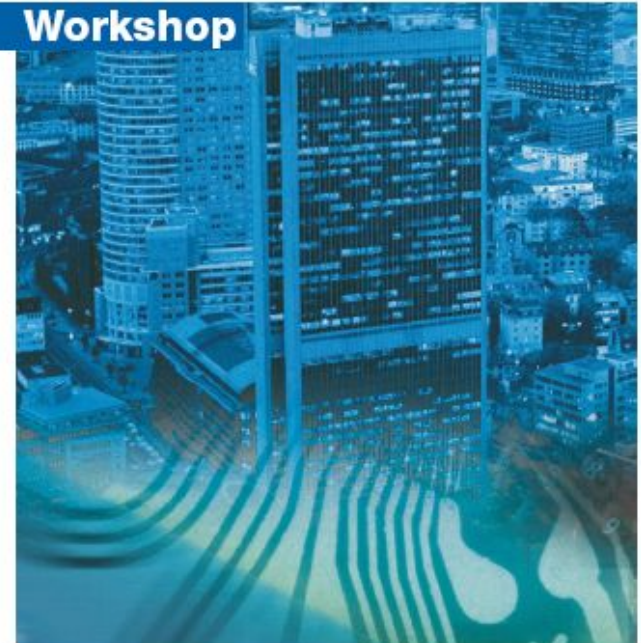
- approve the establishment of ISO/TC 229 *Nanotechnologies* and allocation of the secretariat to BSI by no later than **27 May 2005**.

Please reply by e-mail to the address below and specify the number of this form:

tmb@iso.org

Standardisierungsbedarf in der Nanotechnologie

Workshop



Donnerstag, 23. Juni 2005

10:30 Uhr

Kultur- und Kongresszentrum Jahrhunderthalle

Pfaffenwiese

65929 Frankfurt am Main

150 Teilnehmer



**Mirror Committee DIN NMP xxx
Inaugural Meeting 24.01.2006,
Berlin**

Social programme
Schedule

Time	Location	Event
Wednesday 9 November		
09.00 10.00	Entrance Hall Livery Hall	Registration Opening ceremony for all delegates, their guests and other invitees. Speeches by Lord Sainsbury the UK Government Minister for Science and Innovation, Mike Low the Director BSI British Standards and Professor Mark Welland of the Royal Society.
10.50-11.00	Reception Room	Coffee break
12.00	Reception Room	Lunch
13.30	Livery Hall	TC 229 plenary
15.00-15.15	Reception Room	Coffee break
17.00		End of Session
17.00 19.00	Reception Room	Social event: Drinks Reception Carriages

Thursday 10 November		
09.00	Livery Hall	TC 229 plenary
10.30-10.45	Reception Room	Coffee break
12.00	Reception Room	Lunch
13.00	Livery Hall	TC 229 plenary
15.00-15.15	Reception Room	Coffee break
17.00		End of Session
19.00	Shakespeare's Globe	Social event: Tour of the reconstructed Shakespeare's Globe theatre
19.30 for 20.00 23.00	The Underglobe	Social event: Dinner Carriages

Friday 11 November		
09.00	Livery Hall	TC 229 plenary
10.30-10.45	Reception Room	Coffee break
12.00		Meeting concludes

Note: delegates will need to book for the social events – please see the Booking Form



Nanotechnologies

Inaugural meeting
of ISO/TC 229

London, 9–11 November 2005



Meeting of ISO/TC 229, London (UK), 9 - 11 November 2005 Nomination of Delegates

Dear Mr. Alcorta,

We are pleased to inform you that Germany will be represented by the following delegates at the meeting mentioned above:

- ▶ Mr. Prof. Dr. rer. nat. Georg Reiners (Head of Delegation)
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
Unter den Eichen 44 – 46
12203 Berlin
Phone: +49 30 8104-1820
georg.reiners@bam.de
- ▶ Mr. Dr. Norbert Fabricius
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH
Postfach 3640
76021 Karlsruhe
Phone: +49 7247 82-8585
E-mail: norbert.fabricius@mikro-nano.fzk.de
- ▶ Mr. Dr. Heinz Hilgers
IBM Deutschland
Mainz
Phone: +49 6131 84-2041
E-mail: hilgers@de.ibm.com
- ▶ Mr. Dr. Martin Riester
NA Maschinenbau (NAM) im DIN
Postfach 71 08 64
60498 Frankfurt am Main
Phone: +49 69 6603-1290
E-mail: martin.riester@vdma.org

▶ Mr. Prof. Dr. rer. nat. Günter Wilkening
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Phone: +49 531 592 5100
E-mail: guenter.wilkening@ptb.de

▶ Mr. Dr. sc. techn. Alois Wehrstedt
NA Materialprüfung (NMP)
im DIN
10772 Berlin
Phone: +49 30 2601-2215
E-mail: alois.wehrstedt@din.de

Yours sincerely,



Dr. A. Wehrstedt

Main topics of the London meeting:



Thematic Areas:

1. Terminology & Nomenclature
2. Basic Metrology; Measurement & Characterisation
3. Performance Criteria + Properties (German proposal)
4. Health & Environmental Impact



Work Plan / Road Map / Call for „New Work Item (NWI)“ proposals



Organisation of TC 229:

Chairman	GB
SC1	NN
SC2	Japanese application
SC3	Germany application
SC4	USA application



Liaisons with ISO/TC's etc.